

## 【第\*\*\*回化学コロキウム】

題目：XAFS を用いた化学状態計測と物性科学

講師：岡林 潤 （東京大学大学院理学系研究科 准教授）

日時：平成30年11月9日（金）5限（16:30-18:00）

場所：\*号館\*\*\*号教室

概要：

スピン系の物性現象を理解する上で、試料全体の磁化測定ではなく、元素別に磁気状態の情報を得ることはメカニズムの解明に本質的な測定となる。放射光を用いたX線吸収分光(XAFS)およびX線磁気分光(X線磁気円二色性:XMCD)が有力な実験手法となる。本講演では、スピントロニクスオーバーを示す磁性錯体およびスピントロニクス素子用の磁性薄膜について、元素別な電子・磁気状態を明確にするXAFS, XMCDを用いた化学結合に基づいた物性について判りやすく解説する。特に、Pd, Cuなどの非磁性体に誘起される磁性について議論する。



奮ってご参加下さい。

問合せ先教員：久富木 志郎(内線3922, e-mail: kubuki@tmu.ac.jp)